

TN-A1 ナノ粗さ・高さ形状計測器

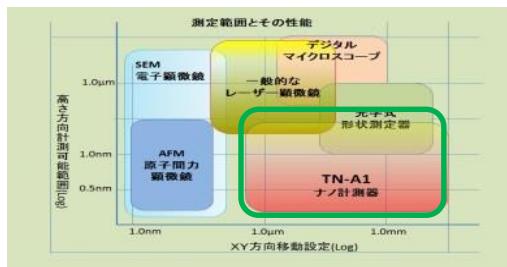
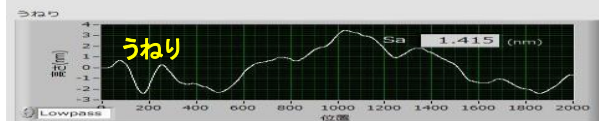
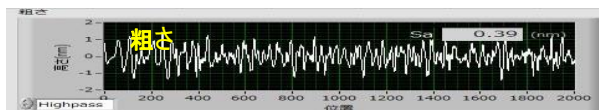
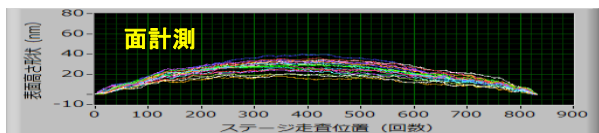
ヘテロサイン干渉法に基づいたナノ領域計測器

● 開発成果品



3D表示

● 試料計測事例



○ 特長① 高さ方向分解能0.1nm

2ビームの位相差検出です。位相差0.1度の検出が可能である。1度=0.88nmで計算される

○ 特長② 振動に強い

2ビームを同時に照射するので外部振動はキャンセルされる。防振台不要

○ 特長③ レーザー光が計測基準値

高さ・うねり・段差の計測値はレーザー光（波長632.8nm）が基準となっている

○ 特長④ 広範囲の計測が可能

標準で25mm×25mmの範囲が計測可能

● 販売価格 850万円計測ソフト・パソコン込

◇ 本事業でうけた主な支援

- * 製品開発プロデューサー
 - ・計測ソフトウェアの開発
 - ・取扱い説明書作成の指導
- * 専門アドバイザー
 - ・販路開拓の指導
 - ・展示会の見せ方とフォロー指導

○ お問い合わせ先

会社名	ツクモ工学株式会社	連絡先	営業部 tel : 04-2952-6008 (代表) mail : nanogap@twin9.co.jp
代表者	代表取締役 服部義次	URL	http://www.twin9.co.jp
所在地	〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8		
事業内容	レーザー応用光学機器の設計・製造・販売、光学システム設計・製造		
取扱い主要製品	精密位置決めステージ・ホルダー、ナノ粗さ高さ計測器		